ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ТРЕКОВ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ В ПОЛИМЕРАХ

А.И.Виленский, Д.Л.Загорский, Н.В.Первов, Б.В.Мчедлишвили Институт кристаллографии РАН, РФ, 117333 Москва, Ленинский пр. 59. Факс (095) 135 1011, E-mail: track@ imb. imb. ac.ru

В работе изучены пленки из полиэтилентерефталата (ПЭТФ), облученные тяжелыми ионами. Облучение ионами Ar, Xe и Bi (энергии до 3.5 MeB/ нуклон, флюенс 10¹⁰ см⁻²) проводилось на ускорителе У-400 в Дубне. Исследовалась структура латентного трека и начальные стадии травления. Диаметр трека (ямки) на поверхности полимера составил 3, 7 и 12 нм для облучения ионами Ar, Xe и Bi, соответственно. Были изучены термосенсибилизация и контракция треков. Показано, что при нагреве образца до 80-100° С скорость травления возрастает (в 1.5-2 раза) а при последующем нагреве- уменьшается. Обсуждаются возможные механизмы этого явления. Показано, что структура трека имеет сложный характер: она состоит из сердцевины, области деструкции и области сшивки. Для ПЭТФ, облученного ионами Xe, эти области составляют соответственно, 7, 17 и 100-150 нм.

Введение

В работе излагаются некоторые физикохимические проблемы, касающиеся получения трековых мембран: сюда входит облучение полимеров тяжелыми ионами, формирование сенсибилизация, термическая треков, ИΧ треков. полученных регрессия Ha основе результатов предложена структура трека тяжелого иона в полимере.

Современная технологическая схема получения ТМ включает следующие операции: облучение пслимерной пленки тяжелыми ионами, в результате которых формируются радиационные дефекты-треки, сенсибилизация облученной пленки (обычно УФ светом), травление латентных треков (ЛТ) до образования на их месте сквозных каналов определенного диаметра.

Основная часть

В настоящей работе полимерную пленку облучали ионами Аг, Хе и Ві с энергиями до 3. 5 Мэв/а.е.м и плотностью до 10¹⁰ циклотроне U-400 в Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н.Флерова (ОИЯИ, г.Дубна). В работе для изучения латентных треков (ЛТ) был использован метод послойного травления, который заключается в последовательном вытравливании областей трека раствором КОН. Состав продуктов радиолиза исследовали с хроматографии. помощью Исходную протравленную пленку изучали методом атомносиловой микроскопии (ACM). Кроме исследовалась проницаемость пленки по воде.

Типичное АСМ-изображение треков тяжелых ионов на поверхности ПЭТФ представлено на рис. 1.

Для ионов Ar , Xe и Bi средние диаметры ЛТ (D₁), составляют 3, 7 и 12 нм, соответственно. Эти размеры примерно соответствуют значению поперечного размера ЛТ, рассчитанному по величине поглощенной энергии. и полученными другими методами исследования [1,2]. Поэтому эти морфологические образования можно отнести к ЛТ и рассматривать их как его сердцевину.

Продукты радиолиза из зоны треков исследовали методом адсорбционной

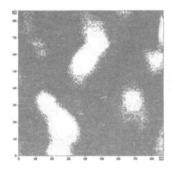


Рис.1. Поверхность ПЭТФ, облученная Xe. Область сканирования 80 ×80 нм

высокоэффективной жидкостной хроматографии обращенными фазами. Для этого экстрагировали водой или раствором КОН (0,25моль/л). При экстракции водой продукты радиолиза удаляли в основном из сердцевины трека. В случае экстракции раствором КОН, вначале ЛТ растравливали до определенного размера, а затем проводили анализ продуктов растворителем травления. Наилучшим опробованных оказалась вода. Продукты радиолиза в течение 10-15 мин удаляются из треков. По характеру хроматограмм, временам продуктов удерживания на гидрофобном адсорбенте (Eurospher C18-5) можно утверждать, что они состоят из низших олигомеров с концевыми карбонильными, карбоксильными, гидроксильными группами. Установлено, что радиационной продукты деструкции гидролитически неустойчивы постепенно разрушаются с образованием, главным образом, терефталевой кислоты.

Нами исследованы закономерности травления ЛТ до образования пор и кинетика накопления продуктов радиолиза в растворе для травления (рис2) .

Обнаружено, что образование пор в полимере происходит не сразу. Вначале за счет капиллярных сил происходит проникновение электролита в рыхлую структуру трека и удаление низкомолекулярных продуктов радиолиза.

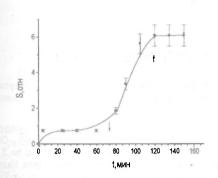


Рис.2. Кинетика накопления продуктов пор радиолиза. Стрелки указывают на образование пор 7 нм (70 мин) и 60 нм (120 мин). S- суммарная площадь пиков на хроматограмме.

В этот период пленка проницаема для воды (примерный диаметр пор около 7 нм). Затем начинается набухание сшитой (за счет вторичных электронов) области полимера вокруг оси трека. т.е. происходит формирование гелеобразного слоя. Эта область была обнаружена методом микроскопии (ACM) атомно-силовой характерным бугоркам [3,4]. Изображение такого бугорка показано на рис.3. Пленка при этом становится непроницаемой для воды (плато на рис.2). В определенный момент гелеобразные слои разрушаются и на их месте образуются сквозные каналы с минимально возможным размером пор 7нм.

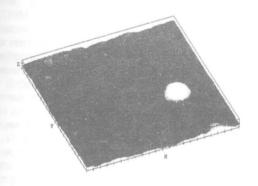


Рис.3. Область трека Xe, набухшего в растворе КОН. Область сканирования 22x23 нм

Установлено, что диаметры этих каналов зависят от массы и энергии иона, используемого для облучения полимера и, примерно совпадают с размером сердцевины трека: для иона Хе примерно 7нм. В случае облучения ионами Ві и Аг минимальные размеры таких каналов составили соответственно 12 и 3 нм. Таким

образом, минимальные размеры каналов пор соответствуют размерам сердцевин трека.

Исследовано явление термосенсибилизации и контракции треков. Термосенсибилизация – повышение скорости травления после предварительной термообработки облученной пленки вплоть до 80°C Этот эффект можно объяснить терморазрушением продуктов радиолиза R области ЛТ с образованием соединений с меньшей молекулярной массой. В результате ускоряется диффузия, следовательно, и скорость травления треков. При более температуре скорость травления падает (контракция треков-[1]) Наибольшее падение скорости травления ЛТ происходит в интервале температур 100-150°С. Установлено, что после термообработки облученной пленки в треке образуются области диаметром 10, 20 и 30 нм, имеющие повышенную химическую стойкость. Образование этих областей в интервале температур $100\text{-}200^{\circ}\text{C}$ можно объяснить более глубоким разрушением продуктов радиопиза с образованием графитоподобного полимера. Таким образом, термообработка ЛТ в ПЭТФ выявляет сложную структуру трека.

Исследована сенсибилизация ЛТ в ПЭТФ. Установлено, что УФ и гамма сенсибилизация ускоряет травление треков в несколько раз в диапазоне диаметров пор 7 - 50 нм. С помощью хроматографии обнаружено, что под воздействием УФ или гамма облучения происходит разрушение продуктов радиолиза с образованием в зоне трека терефталевой кислоты. Методом АСМ показано также, что УФ и гамма облучение разрушают сшитую область трека- исчезают бугорки на поверхности образца. Это, в свою очередь, причиной ускорения является основной травления трека.

Заключение

Таким образом, вышеприведенные исследования показали, что треки тяжелых высокоэнергетических ионов в полимере имеют сложную структуру, которая, по нашему мнению, состоит из нескольких областей:

- 1 -сердцевина трека тяжелого иона. Средний диаметр этой области трека иона Хе равен примерно 7 нм и соответствует размерам треков, полученных расчетным путем по величине поглощенной энергии.
- 2 область, в которой преобладает деструкция полимера, ее средний размер для этого иона составляет около 17 нм.
- 3 область, в которой преобладает сшивка, с размером до ≅ 150 нм . Такая сложная структура треков позволяет объяснить различия в их размерах, существующие в литературе .

Список литературы

- 1. *С.Дюррани, Р.Балл.* Твердотельные ядерные детекторы. М:- Энергоатомиздат, 1990. 263 с.
- 2. *Р.Л.Флейшер, П.Б.Прайс, Р.М.Уокер*, Треки заряженных частиц в твердых телах.- М.: Энергоатомиздат, 1981.- 248 с.

- А.И.Виленский, А.Л.Толстихина // Изв. РАН, Сер.хим. – 1999.-N6 - с.1111.
- А.И.Виленский, А.Л.Толстихина // Изв. РАН Сер.хим. – 1999.-N6 - с.1115.
- А.Л.Толстихина, А.И.Виленский, Р.В.Гайнутдинов, П.Ю.Апель, Б.В.Мчедлишвили // Поверхность.- 2000.- N12.- с.16.

STRUCTURE OF HEAVY IONS TRACKS IN POLYMER INVESTIGATION

A.Vilensky, D.Zagorski, N.Pervov,B.Mchedlishvili Institute of Crystallography, Moscow, Russia E-mail: track@imb.ac.ru

Polymer (PET) films were irradiated with Ar, Xe and Bi ions (energy up to 3.5 MeV/n and fluence 10¹⁰ cm⁻², Dubna). Structure of latent track as well as initial stages of these track etching were investigated. Track radii were found to be 3 nm, 7 nm, 12 nm for Ar, Xe and Bi ions respectively. Termosensitization and contraction of rack were measured: it was found that etching speed grows up to 80⁰ -100⁰ C and decrease by further heating. Possible mechanisms of such behaviour are discussed. Tracks found to have complex structure: track core (7 nm - for Xe-irradiated polymer), zone of destruction (17 nm) and zone of linking (up to 100-150 nm).